（趣意書）

口内法撮影 X 線装置の日常精度管理用半導体 X 線測定器製作研究会開催の主旨

平成 29 年には国内の歯科診療所は 68,872 施設あり、多くの施設で口内法撮影 X 線装置が使用されています。口内法撮影 X 線装置の基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項（JIS T60601-2-65）が近年改正され口内法撮影 X 線装置の精度管理は一層重要になっています。現在口内法撮影 X 線装置のための市販の精度管理器機は、どれも高性能で優れた製品ですが、極めて高価であり全歯科診療所への普及はとても望めません。そこで私たちは、全ての歯科診療所で口内法撮影 X 線装置の日常的な精度管理に利用できる安価で簡易な半導体 X 線測定器を開発しています。

今回、未だ開発中のものですが、私達の提案する半導体 X 線測定器の簡単な試作機器（線量計と精度管理プログラム等）を実際に製作し、口内法撮影 X 線装置の精度管理に利用してもらうことのできるボランティアを参加費無料で募集します。応募された方から、それらの体験結果を後ほど報告戴くことによって、口内法撮影 X 線装置の精度管理のための試作機器を改良しつつ、安価で充分な性能を有する精度管理器機の完成と普及を図っていきたと考えています。私達の目標は、全歯科診療所で口内法撮影 X 線装置の日常的な精度管理が実施され、このような X 線装置の品質管理と品質保証を通じて、我が国の口内法撮影 X 線検査における患者防護の最適化を達成することです。

応募要領は別紙“日本歯科放射線学会防護委員会共催「半導体 X 線測定器製作研究会」開催のご案内”をご覧下さい。

首都大学東京
健康福祉学部 放射線学科
根岸　徹
e-mail address : negishit@tmu.ac.jp
〒116-8551　東京都荒川区東尾久 7-2-10
TEL　:　03-3819-1211
FAX　:　03-3819-1406